⑩ 日本 国特許 庁(JP) ⑪実用新案出願公開

☞ 公開実用新案公報(U) 平4-5652

@Int. CI. 5

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成4年(1992)1月20日

H 01 L 23/48 21/60

301 B

9054-4M 6918-4M

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

❷考案の名称 半導体装置

②実 類 平2-46506

劉山 颖 平2(1990)4月26日

团号 案 者 中道 頻数

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

勿出 願 人 シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

29代 理 人 弁理士 中村 恒久



明細音

1. 考案の名称

半導体装置

2. 実用新案登録請求の範囲

半導体素子と、該半導体素子が搭載される搭載 用リードフレームと、ボンデイングワイヤを介し て前記半導体素子と内部結線される結線用リード フレームとを備え、これらが封止樹脂にて樹脂にて成る半導体装置において、前記搭載用リードフレームおよび結線用リードフレームを置され、前記半導体素子は、前記搭載 用リードフレームの樹脂対で、前記搭載 オリードフレームの樹脂対で、前記搭載 オリードフレームの樹脂対でする されたことを特徴とする半導体装置。

3. 考案の詳細な説明

〈産業上の利用分野〉

本考案は、半導体装置に関し、特に半導体案子の樹脂封止に係る。

650 実開4- 5652



〈 従来技術 〉

従来の半導体装置は、第6~9図の如く、搭載 用リードフレーム1上のランド部1aに半導体素 子2をダイボンドし、これに対向して配された結 線用リードフレーム3のランド部3aとの間に電 気的導通を取るためにボンデイングワイヤ4を張 り、さらにエポキシ等の有機樹脂5を用いて樹脂 封止して外装ケース6を形成している。

ところで、半導体素子 2 の搭載箇所(ランド部 1 a)およびボンデイングワイヤ 4 の結線箇所(ランド部 3 a)は、互いに向かい合つた 8 0 ~ 2 0 0 μ n の 線幅を有する細線状のリードフレーム 1 , 3 上の 最先端部分に配されている。

したがつて、第9図の如く、ボンデイングワイヤ4の一端は、リードフレーム1のランド部1a 上に銀ペーストまたは金ペーストにより貼り付けられた半導体素子2の電極2aに結線され、他端は、リードフレーム1に対向する結線用リードフレーム3のランド部3aに結線されることになる。その後、第8図の如く、封止樹脂5により樹脂成 形(外装ケース 6)され、リードフレーム 1,3 の両端リード部 1b,3 bが外装ケース 6 から突出した構造となる。

このように、リードフレーム1,3のリード部が外装ケース6から突出しているから、使用雰囲気温度の変化に伴い、各リードフレーム1,3が、その長手方向に伸びまたは縮みが発生する。

〈 考案が解決しようとする課題 〉

従来の半導体装置の構造に基づいて、発光素子チップ(LED)や受光素子チップ(PD.PT)等の半導体素子2を搭載用リードフレーム1上にダイボンドし、ボンデイングワイヤ4により半導体素子2と結線用リードフレーム3とを内部結線し、樹脂モールドを行つて、光アイソレータ、発光ダイオード(LED)ランプおよびフオトダイオード等を作製した場合、温度衝撃発生時や低温動作試験等に、ボンディングワイヤ4が、第9図中のXの場所で断線し、製品が不良となる場合がある。

この断線の原因は、リードフレーム1,3の線 膨張係数と、封止用エポキシ樹脂5の線膨張係数

との差に基づく。もちろん、双方の熱膨張係数を 極力合せるように努力が図られているものの、材 料自体が違うため、上記事態を避けることはでき ない。

ここで、表1に、一般的にリードフレームとして使用される材料とエポキシ樹脂材料についての 線膨張係数を示す。表1の如く、両者の間には、 4倍~30倍以上もの膨張差が認められる。

材料名	線膨張係数(℃~1)
銅	16.5×10 - 6
42701	4 . 6 × 1 0 - B
铁	11.8×10 ° a
エポキシ樹脂	6.2~16.7×10 ⁻⁵

従来の半導体装置では、前述のように、半導体 素子2の搭載用ランド部1aおよびポンデイング ワイヤ4のランド部3aが、共に各リードフレー ム1.3の先端部、すなわち温度変動に基づく伸 縮が最大となる箇所に配置されているので、樹脂 成形して完成品とした後、熱衝撃発生時や低温動作試験時に、ランド部 1 a, 3 a間に張設されたボンディングワイヤ 5 の破断が時として発生している。

本考案は、上記に鑑み、リードフレームの熱伸 縮によるボンデイングワイヤの断線を防止して品 質の向上を図り得る半導体装置の提供を目的とす る。

〈 課題を解決するための手段 〉

本考案による課題解決手段は、第1図ないし第 5図の如く、半導体素子11と、該半導体素子1 1が搭載される搭載用リードフレーム12と、ボ ンデイングワイヤ13を介して前記半導体素子1 1と内部結線される結線用リードフレーム14と を備え、これらが封止樹脂15にて樹脂封止され で成る半導体装置において、前記搭載用リードフレーム12および結線用リードフレーム14は いに平行に並置され、前記半導体素子11は、前 記搭載用リードフレーム12の樹脂封止領域の中 央部に搭載され、前記ポンデイングワイヤ13は、

前記半導体素子11と前記結線用リードフレーム 14との間で該リードフレームの長手方向に対し て直交する方向に張設されたものである。

〈作用〉

上記課題解決手段において、その製造時には、 搭載用リードフレーム12に半導体業子11を搭載し、半導体素子11の電極と結線用リードフレ ーム14との間にポンデイングワイヤ13を張る。 そして、これらを封止樹脂15にて樹脂封止して 半導体装置の完成に至る。

このとき、搭載用リードフレーム12および結線用リードフレーム14を平行に並置し、半導体素子11を搭載用リードフレーム12の樹脂封止領域の中央部に配置し、ボンデイングワイヤ13を半導体素子11と結線用リードフレーム14との間でリードフレームの長手方向に対して直交する方向に張設しているので、ボンデイングワイヤ13を、リードフレーム12.14の最も膨張率の大きい方向を回避して張設することができ、ボンデイングワイヤ13に対するリードフレーム1

2の熱による伸び縮みの影響を極めて小さくできる。

したがつて、熱衝撃や、低温通電時に発生する リードフレームの伸縮等に伴うボンデイングワイ ヤの断線を防止して、製品の信頼性の向上を図る ことができる。

〈実施例〉

以下、本考案の実施例を図面に基づいて説明する。

(第一実施例)

第1図は本考案第一実施例を示す半導体装置の 機断平面図、第2図は同じくその縦断側面図、第 3図は同じくその斜視図である。

図示の如く、本実施例の半導体装置は、半導体素子11と、該半導体素子11が搭載される搭載用リードフレーム12と、ポンデイングワイヤ13を介して、前記半導体素子11に内部結線される結線用リードフレーム14とを備え、これらが封止樹脂15(エポキシ樹脂)にて樹脂封止されて成るものである。

前記搭載用リードフレーム12および結線用リードフレーム14は、第1図の如く、銅、42アロイまたは鉄等から成る細線状の薄板であつて、これらは互いに平行に並置されている。

そして、搭載用リードフレーム12は、半導体素子11が搭載される搭載用ランド部22と、外部に入出力するリード部23とから構成されている。

前記搭載用ランド部22は、リード部23の中央部に配されており、リード部23の中央位置から内側に突出するよう一体形成されている。これにより、前記半導体素子11は、搭載用リードフレーム12の樹脂封止領域中央部に搭載されることになる。

前記リード部23は、第3図の如く、封止樹脂 15、すなわち外装ケースの両側端部から外部に 直線状に引き出されており、第2図の如く、ラン ド部22との接合部は、半導体素子11が樹脂1 5の肉厚の中心に位置するよう略凹字形に曲げ加 工が施されている。 一方、結線用リードフレーム14は、第1図の如く、ボンデイングワイヤ13の一端が結線される結線用ランド部25と、外部部品に入出力するリード部26とから構成されている。

前記結線用ランド部25は、第1図の如く、搭 載用ランド部22と同様、リード部26の中央位置に配されており、リード部26の中央位置から 内側に突出するよう一体形成されている。このため、ボンデイングワイヤ13は、その他端を前記 半導体素子11の電極21に接続することにより、 結線用リードフレーム14に、その長手方向に対して直交する方向に張設されることになる。

なお、結線用リードフレーム 1 4 のリード部 2 6 については、搭載用リードフレーム 1 2 のリード部 2 3 と同様の構成であるので、説明を省略する。

上記構成の半導体装置は、以下のように製造される。

まず、搭載用リードフレーム12の搭載用ランド部22に半導体業子11を搭載する。

そして、半導体素子11の電極21と結線用リードフレーム14の結線用ランド部25との間にポンデイングワイヤ13を張る。

しかる後、これらを封止樹脂15にて樹脂封止 して半導体装置の完成に至る。

このとき、搭載用リードフレーム12および結線用リードフレーム14を平行に並置し、しかもリードフレーム12,14の各ランド部22,25をリード部23,26の中央部に配置しているので、半導体素子11は、搭載用リードフレーム12の樹脂封止領域の中央部に位置され、ボンディングワイヤ13は、半導体素子11と結線用リードフレーム14との間でリードフレームからその長手方向に対して直交する方向に張設されることになる。

これにより、ボンデイングワイヤ13を、リードフレーム12,14の最も膨張率の大きい方向を回避して張設することができるので、ボンデイングワイヤ13に対するリードフレーム12の熱による伸び縮みの影響を極めて小さくできる。

したがつて、熱衝撃発生時や低温通電時におけるリードフレームの伸縮に伴うボンデイングワイヤの断線を防止して、製品の信頼性の向上を図ることができる。

また、リードフレーム12.14の中央部に、 略凹字形の曲げ加工を施しているので、ワイヤボンド時に著しい加工変形を受ける部分X(第2図 参照)が封止樹脂15の肉厚の中心に配置される こととなり、樹脂封止時の応力のバランスを図る ことができる。しかも、リードフレームと樹脂と の界面の延面距離を大きく設計できるため、耐湿 性の向上に繋がる。

したがつて、より一層の信頼性の向上が期待で きる。

さらに従来のように、封止樹脂15とリードフレーム12.14との無膨張係数を極力近づけるために努力を傾注しなくても済むので、封脂樹脂の選定が容易となる。

(第二実施例)

第4図は本考案第二実施例を示す半導体装置の 660

横断平面図、第5図は同じくその縦断側面図である。

図示の如く、本実施例の半導体装置は、搭載用リードフレーム12および結線用リードフレーム14にランド部を設けないストレート型のものを使用し、搭載用リードフレーム12の中央部に半導体素子11を搭載し、ボンデイングワイヤ13により半導体素子11と結線用リードフレーム14の中央部とに内部結線を施したものである。

その他の構成および作用、効果は第一実施例と同様である。

なお、本考案は、上記実施例に限定されるものではなく、本考案の範囲内で上記実施例に多くの 修正および変更を加え得ることは勿論である。

〈考案の効果〉

以上の説明から明らかな通り、本考案によると、 搭載用リードフレームおよび結線用リードフレーム および結線用リードフレームが互いに平行に並置され、半導体素子が、前記 搭載用リードフレームの樹脂封止領域中央部に搭載され、ボンデイングワイヤが、前記半導体素子

と前記結線用リードフレームとの間で該リードフレームの長手方向に対して直交する方向に張設されているので、ボンデイングワイヤをリードフレームの最も膨張率の大きい方向を回避して張設することができる。

したがつて、ボンデイングワイヤに対するリードフレームの熱による伸び縮みの影響を極めて小さくでき、熱衝撃や、低温通電時に発生するリードフレームの伸縮に伴うボンデイングワイヤの断線を防止して、製品の信頼性の向上を図ることができる。

また、従来のように、封止樹脂とリードフレームとの熱膨張係数を極力近づけるために努力を傾注しなくても済むので、封脂樹脂の選定が容易になるといった優れた効果がある。

4 図面の簡単な説明

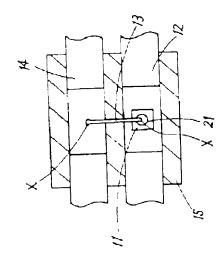
第1図は本考案第一実施例を示す半導体装置の 機断平面図、第2図は同じくその縦断側面図、第 3図は同じくその斜視図、第4図は本考案第二実 施例を示す半導体装置の機断平面図、第5図は同

じくその縦断側面図、第6図は従来の半導体装置の横断平面図、第7図は同じくその縦断側面図、第8図は同じくその斜視図、第9図は同じくその要部拡大図である。

11:半導体素子、12:搭載用リードフレーム、 13:ボンデイングワイヤ、14:結線用リードフ レーム、15:封止樹脂。

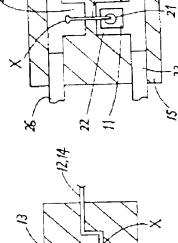
> 出 願 人 シャープ株式会社 代 理 人 中 村 恒 久

第4四

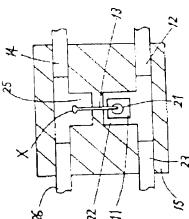


22,25

第 2 図

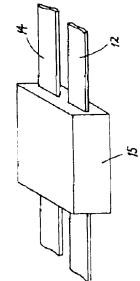


第一双

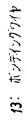


数 3 3 3

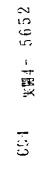
₩ 5 €



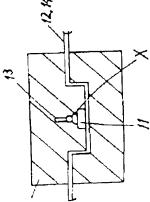






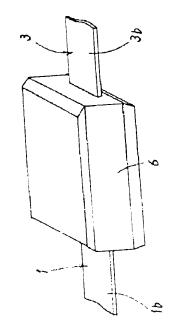


代理人中村恒久

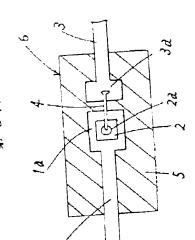


2

数8款

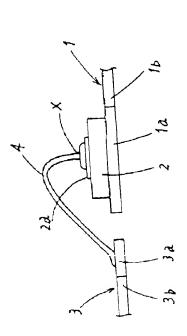


第6図



第7四

数 6 强



集開4-5652 代學人中村恒久

239